

КЭЛТ-2019

ПРОГРАММА УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

30 сентября, понедельник

14.00 – 17.00

Открытие Конференции

Секция I. Характеризация полупроводниковых материалов и структур

Якимов Евгений Борисович, ИПТМ РАН

Исследование кристаллов Ga₂O₃ методом катодolumинесценции 20 мин.

Вергелес Павел Сергеевич, ИПТМ РАН

Исследование температурной зависимости размеров дислокационных розеток в GaN методом катодolumинесценции

П.С. Вергелес, В.И. Орлов, Е.Б. Якимов 20 мин.

Ковешников Сергей Викторович, ИПТМ РАН

Исследование процессов накопления заряда в пленках SiO₂ и Si₃N₄ под воздействием низкоэнергетичного электронного пучка, ЭЦР водородной плазмы и облучения высокоэнергетичными частицами

С.В. Ковешников, О.А. Солтанович, М.А. Князев, А.В. Ковальчук, Ю.А. Коржов, С.И. Коденцев, А.С. Россов, С.В. Нефедьев, С.Ю. Шаповал 20 мин.

Перерыв 20 мин. (15.25 – 15.45)

Еременко Валентин Григорьевич, ИПТМ РАН

Гексагональный политип кремния Si-IV. ТЕМ и АСМ микроскопия 20 мин.

Терещенко Алексей Николаевич, ИФТТ РАН

Влияние геттерирования и термических обработок на температурную зависимость дислокационной люминесценции в ионно-имплантированном кремнии

А.Н. Терещенко, М.А. Хорошева, Д.С. Королёв, А.А. Никольская, А.Н. Михайлов, А.И. Белов, Д.И. Тетельбаум 20 мин.

Якимов Евгений Евгеньевич, ИПТМ РАН

Исследование дефектов упаковки в 4H-SiC, введенных при облучении электронным пучком

Е.Е. Якимов, Е.Б. Якимов 20 мин.

17.00 Стендовая сессия для секций: I, II, VII

18.00 Вечер встречи

1 октября, вторник

10.00 – 18.10

Секция II. Характеризация материалов и структур методами ПЭМ

Суворова Елена Игоревна, ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН
Аналитическая электронная микроскопия биогенных наночастиц диоксида урана: экспериментальные данные и моделирование 20 мин.

Приходько Александр Сергеевич, НИУ "МИЭТ"
Прецизионное определение расстояния между слоями графена методом высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии
А.С. Приходько, Н.И. Боргардт, М. Heilmann, M.J. Lopes 20 мин.

Николайчик Владимир Иванович, ИПТМ РАН
Электронно-микроскопическое исследование наноразмерных частиц диоксида титана
В.И. Николайчик, И.И. Ходос, О.И. Тимаева, Г.М. Кузьмичёва 20 мин.

Перерыв 20 мин. (11.15 – 11.35)

Загорский Дмитрий Львович, ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН
Микроскопия в исследовании гетероструктурных нанопроволок, полученных методом матричного синтеза
И.М. Долуденко, О.М. Жигалина, В.М. Каневский, Д.Л. Загорский, С.А. Бедин, В.В. Артёмов, Д.Н. Хмеленин, И.М. Иванов 20 мин.

Гусев Сергей Александрович, ИФМ РАН
Просвечивающая электронная микроскопия магнитных наноструктур
С.А. Гусев, Ю.В. Петров, Д.А. Татарский, А.Л. Чувилин 20 мин.

Татарский Дмитрий Аркадьевич, ИФМ РАН
Управление магнитными свойствами многослойных структур на основе Со и их характеризация методами ПЭМ
Д.А. Татарский, Н.С. Гусев, М.В. Сапожников, А.Л. Чувилин, С.А. Гусев 20 мин.

Обед 12.50 – 14.10

Секция III. Характеризация материалов и структур методами РЭМ

Гостева Екатерина Александровна, НИТУ "МИСиС"
Характеризация структур на основе пористого кремния и графена методами РЭМ и сорбометрии
Е.А. Гостева, В.В. Старков, А.О. Белорус, Д.М. Седловец 20 мин.

Быков Александр Сергеевич, НИТУ "МИСиС"
Исследование перераспределения элементов в области воздействия лазерного излучения в водной среде методом электронной Оже-спектроскопии
Д.А. Подгорный, М.В. Конюхов, А.С. Быков, К.А. Щербаков, Е.С. Шитова, Э.Р. Нурбакиева, П.В. Болотова 20 мин.

Михеев Николай Николаевич, ЛКМ ИК РАН
Двухпотоковая модель обратного рассеяния моноэнергетического пучка электронов: приложение к задачам диагностики тонкопленочных структур 20 мин.

Полищук Владимир Анатольевич, Университет морского и речного флота
Особенности формирования морфологии поверхности напыленных пленок Zn
В.А. Полищук, В.В. Томаев 20 мин.

Перерыв 20 мин. (15.50 – 16.10)

Секция VII. Новые материалы для микроэлектроники

Баталов Рафаэль Ильясович, КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН
Структура и фотоэлектрические свойства гипердопированных металлами слоёв кремния
Р.И. Баталов, Р.М. Баязитов, И.А. Файзрахманов, Н.М. Лядов, Р.И. Хайбуллин, А.И. Гумаров 20 мин.

Кононенко Олег Викторович, ИПТМ РАН
Структура и свойства турбостратного мультислойного графена, синтезированного на пленках железа
О.В. Кононенко, В.Н. Матвеев, В.И. Левашов, И.И. Ходос, О.В. Трофимов 20 мин.

Дорохин Михаил Владимирович, НИФТИ ННГУ
Получение методом электроимпульсного плазменного спекания и исследование свойств нового функционального наноматериала, содержащего наночастицы Si в матрице SiO₂
М.В. Дорохин, М.В. Ведь, П.Б. Дёмина, Ю.М. Кузнецов, И.В. Ерофеева, М.С. Болдин, Е.А. Ланцев, А.А. Попов, А.В. Боряков 20 мин.

Коплак Оксана Вячеславовна, ИПХФ РАН
RE-TM микропровода с бистабильным переключением
О.В. Коплак, Р.Б. Моргунов 20 мин.

Шаталов Александр Сергеевич, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
Создание спин-инжекторного источника терагерцового излучения на основе массива нанопроволок из ферритмагнитных металлов
А.С. Шаталов, Д.А. Черкасов, Д.Л. Загорский, А.Э. Муслимов, В.М. Каневский, С.Г. Чигарев 20 мин.

18.10 Стендовая сессия для секции III

2 октября, среда

10.00 – 17.30

Секция VIII. Характеризация материалов и структур методами рентгеновской микроскопии

Рощупкин Дмитрий Валентинович, ИПТМ РАН
Рентгеновские дифракционные методы для исследований материалов и структур микро- и нанoeлектроники
Д.В. Рощупкин, Д.В. Иржак 20 мин.

Чукалина Марина Валерьевна, ИК РАН ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
Совместная обработка и представление данных разнотипных измерений в задаче исследования микроструктур: этапы, методы, решения
20 мин.

Секция IV. Сканирующая зондовая микроскопия, зондовая нанолитография и спектроскопия

Чайка Александр Николаевич, ИФТТ РАН

СТМ/СТС-исследования электронной структуры нанополос графена на поверхности SiC(001)

А.Н. Чайка, В. Walls, O.V. Molodtsova, H.-C. Wu, M.-C. Hsu, T.-W. Huang, C.-R. Chang, K. Zhussupbekov, I.V. Shvets, В.Ю. Аристов 20 мин.

Фомин Лев Александрович, ИПТМ РАН

Исследования морфологии и магнитных свойств островковых метаматериалов с применением атомно-силовой и магнитно-силовой микроскопии

А.В. Черных, Л.А. Фомин, В.А. Березин, Б.А. Логинов, А.Б. Логинов 20 мин.

Перерыв 20 мин. (11.40 – 12.00)

Голубок Александр Олегович, ИАП РАН

Особенности совмещения СЭМ-СЗМ

А.О. Голубок, О.М. Горбенко, И.Д. Сапожников, М.Л. Фельштын 20 мин.

Боднарчук Ядвига Викторовна, ФНИЦ «Кристаллография и Фотоника» РАН

Создание доменных структур в кристаллах $\text{Sr}_x\text{Ba}_{1-x}\text{Nb}_2\text{O}_6$ методом электронного облучения

Я.В. Боднарчук, Р.В. Гайнутдинов, Т.Р. Волк, Л.С. Коханчик, Е.Б. Якимов, Л.И. Ивлева 20 мин.

Толстихина Алла Леонидовна, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

Сканирующая емкостная силовая микроскопия в исследовании модулированных примесью сегнетоэлектрических структур

20 мин.

Селезнёва Елена Вячеславовна, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

АСМ-исследование новых суперпротонных кристаллов $(\text{K}_{0.43}(\text{NH}_4)_{0.57})_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$

А.Л. Толстихина, Р.В. Гайнутдинов, Е.В. Селезнева, И.П. Макарова 20 мин.

Кокатев Александр Николаевич, ФГБОУ ВО ПетрГУ

Диагностика алюмооксидных нанопористых мембран методом атомно-силовой микроскопии

А.Н. Кокатев, С.Г. Васильев, Н.М. Яковлева, К.В. Степанова 20 мин.

Обед 14.05 – 15.30

Секция V. Электронная и ионная литографии

Боргардт Николай Иванович, Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Формирование микро- и наноструктур методом фокусированного ионного пучка

Н.И. Боргардт, А.В. Румянцев 20 мин.

Артемов Владимир Викторович, ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН

Ионная литография полимерных слоев, ориентирующих жидкокристаллические метаповерхности

В.В. Артемов, А.А. Ежов, Р.В. Гайнутдинов, М.В. Горкунов 20 мин.

Killian Walshe, CRANN, Trinity College

Surface modification on $\text{MoO}_{2+x}/\text{Mo}(110)$ induced by a local electric potential

K. Walshe, S.I. Bozhkol, N. Tulina, B. Walls, O. Lubben, B.E. Murphy, V.Bozhko, I.V. Shvets 20 мин.

Гуртовой Владимир Леонидович, ИПТМ РАН

Субмикронные неорганические маски для создания сверхпроводящих наноструктур с джозефсоновскими переходами

В.Л. Гуртовой, С.Б. Изъюров, И.Н. Храпач, О.В. Астафьев

20 мин.

Шабельникова Яна Леонидовна, ИПТМ РАН

Ионная литография: сравнение поглощенной энергии и скорости травления резиста с электронной литографией

Я.Л. Шабельникова, С.И. Зайцев, А.А. Свинцов

20 мин.

17.30 Стендовая сессия для секций: IV, V, VI

3 октября, четверг

Секция VI. Электронно - лучевые технологии: создание микро- и наноструктур, 3D печать, электронно-лучевая сварка, электронно-лучевая плавка

Колосов Владимир Юрьевич, УрФУ (Уральский федеральный университет)

Локальный отжиг e-пучком, ПЭМ и in situ исследования точек кристаллизации, формируемых в аморфных плёнках

20 мин.

Ковальчук Анатолий Викторович, ИПТМ РАН

Применение 3D фемтосекундной лазерной литографии для технологических процессов в микроэлектронике и для технологии метаматериалов

А.В. Ковальчук, Е.А. Полушкин, А.А. Деменев, С.Ю. Шаповал

20 мин.

Коханчик Людмила Сергеевна, ИПТМ РАН

Электронно-лучевая запись периодических доменных структур в оптических волноводах на ниобате лития для реализации квази-синхронного преобразования лазерного излучения

Л.С. Коханчик, С.М. Шандаров, Т.Р. Волк

20 мин.

Казьмирук Вячеслав Васильевич, ФГБУН ИПТМ РАН

Разработка многоколонного электронного литографа для производства шаблонов КМОП СБИС с технологической нормой 65 нм

В.В. Казьмирук, И.Г. Курганов, А.А. Подкопаев, Т.Н. Савицкая

20 мин.

12.00 Закрытие Конференции

ПРОГРАММА СТЕНДОВЫХ СЕССИЙ

Секция I Характеризация полупроводниковых материалов и структур
Понедельник, 30 сентября, 17.00

Гременок Валерий Феликсович, ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению"

Получение и рентгенографические исследования твёрдых растворов системы $\text{Cu}_2\text{ZnGe}_x\text{Si}_{1-x}\text{Se}_4$

А.У. Шелег, В.Г. Гуртовой, В.Ф. Гременок, Т.В. Петлицкая, Г.Ф. Новиков, Е.В. Рабок, В.В. Ракитин

Демидов Евгений Владимирович, РГПУ им. А. И. Герцена

Атомно-силовая и электронная микроскопия монокристаллических пленок висмута и твердого раствора висмут-сурьма

В.М. Грабов, Е.В. Демидов, В.А. Комаров, А.В. Сулов, М.В. Сулов

Дремова Надежда Николаевна, ИПХФ РАН

Исследование методом СЭМ пленок политетрафторэтилена, наполненных малослойными графитовыми нанопластинками

Н.Н. Дремова, А.В. Мележик, Е.Н. Кабачков, Н.В. Лысков, А.Г. Ткачев, Ю.М. Шульга

Князев Максим Александрович, ИПТМ РАН

ВФХ характеристики МДП структур с оксидом кремния, облученных в РЭМ электронами с энергией 3 кВ и 5 кВ

М.А. Князев, Д.М. Седловец, О.А. Солтанович, С.В. Ковешников

Куланчиков Юрий Олегович, ИПТМ РАН

Исследование влияния облучения низкоэнергетичным электронным пучком на вольт-фарадные характеристики SiO_2

Ю.О. Куланчиков, П.С. Вергелес, Е.Б. Якимов

Куманькин Дмитрий Сергеевич, ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарёва"

Исследование структуры плёнок ИТО, полученных методом термического распыления

Д.С. Куманькин, К.Н. Нищев, С.Н. Ушаков, М.А. Усламина, Б.Н. Денисов, П.С. Петров, В.П. Мишкин, Е.Н. Лютова

Орлов Валерий Иванович, ИПТМ РАН, ИФТТ РАН

Использование EBIC, LBIC и DLTS методов для изучения электрической активности протяженных дефектов в кремнии

В.И. Орлов, О.А. Солтанович, О.В. Феклисова, Н.А. Ярыкин, Е.Б. Якимов

Привезенцев Владимир Владимирович, ФТИАН РАН

Исследование кремния, имплантированного ионами цинка и кислорода и отожженного в вакууме при повышенных температурах

В.В. Привезенцев, А.Н. Палагушкин, В.С. Куликаускас, В.И. Зиненко, Бурмистров, Д.А. Киселев, Т.С. Ильина, А.Т. Терещенко

Соколов Леонид Владимирович, АО "РПКБ"

Исследование переходного слоя на границах раздела кремний-стекловидный диэлектрик-кремний чипа микромеханического тензопреобразователя

Станчик Алёна Викторовна, ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению"

Влияние времени селенизации на формирование морфологии тонких пленок $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$, осажденных на гибкой металлической подложке

А.В. Станчик, В.Ф. Гременок, С.М. Барайшук

Феклисова Ольга Владимировна, ИПТМ РАН

Исследование особенностей электрической активности следов за дислокациями в кремнии методами EBIC, LBIC и DLTS

В.И. Орлов, О.В. Феклисова, Е.Б. Якимов

Юрасов Юрий Игоревич, ФИЦ ЮНЦ РАН

Новый метод описания диэлектрических спектров нелинейных диэлектриков

Ю.И. Юрасов, А.В. Назаренко

Секция II. Характеризация материалов и структур методами ПЭМ
Понедельник, 30 сентября, 17.00

Белоногов Евгений Константинович, ВГТУ

Характеризация структуры пленок Li-Nb-O, нанесенных в процессе ВЧМР или ИЛР

Е.К. Белоногов, В.А. Дыбов, В.М. Иевлев, С.В. Канныкин, Д.В. Сериков, А.В. Ситников, М.П. Сумец

Землякова Наталья В., ИПФ РАН

Аккомодация структуры чистой меди М 1 в течение РКУП

Н.В. Землякова, С.О. Рогачев

Зыбина Юлия Сергеевна, НИУ МИЭТ

Особенности структуры и состава поверхностных образований в эпитаксиальных пленках $\text{Ge}_3\text{Sb}_2\text{Te}_6$ по данным электронной микроскопии

Ю.С. Зыбина, А.С. Приходько, Н.И. Боргардт, E. Zallo, R. Calarco

Касумов Юсиф Алекберович, ИПТМ РАН

Атомная структура тонких нанопроволок Bi

Ю.А. Касумов, В.Т. Волков, И.И. Ходос, А.Ю. Касумов

Милович Филипп Олегович, НИТУ «МИСиС»

Влияние высокотемпературного отжига на валентное состояние ионов Се и механические свойства кристаллов $(\text{ZrO}_2)_{0.972}(\text{Y}_2\text{O}_3)_{0.02}(\text{CeO}_2)_{0.008}$

Ф.О. Милович, А.В. Кулебякин, И.Е. Курицына, Н.В. Сидорова, Н.Ю. Шульга, И.В. Яцык

Попов Владимир Алексеевич, НИТУ "МИСиС"

Исследование структуры металломатричных композитов с наноразмерными упрочняющими частицами, полученными с применением нанопроволок, методами просвечивающей электронной микроскопии

В.А. Попов, И.И. Ходос, М.Н. Ковальчук, Е.В. Вершинина

Рудич Никита Вячеславович, НИУ МИЭТ

Исследование влияния на интенсивность электронов с характеристическими потерями энергии глубины залегания атома кремния в кристалле германия при разной его толщине

Н.В. Рудич, А.В. Зыков, Н.И. Боргардт

Сазонов Вадим Андреевич, НИУ МИЭТ

Количественная характеристика зерен в слое LT-GaAs методами просвечивающей растровой электронной микроскопии

В.А. Сазонов, В.Н. Кукин, Н.И. Боргардт, И.П. Казаков

Сушков Артём Александрович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Исследование поперечного среза буферных слоев, используемых для создания светоизлучающих структур на основе полупроводников A3B5 на радиационно-стойких подложках

А.А. Сушков, Д.А. Павлов, В.Г. Шенгуров, С.А. Денисов, В.Ю. Чалков, Н.В. Байдусь, А.В. Рыков, Р.Н. Крюков

Сушков Артём Александрович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Исследование поперечного среза слоя Ge с гексагональной фазой на подложке Si (001)

Р.И. Муртазин, Д.А. Павлов, А.А. Сушков, Н.О. Кривулин, Е.С. Кочугова

Юшков Антон Александрович, УрФУ
Нано-трубки, рельсы, пластинки-хлопы образцов Ti-Se под воздействием электронного пучка в ПЭМ

В.Ю. Колосов, А.Н. Титов, А.А. Юшков, Н.Ю. Елисеева

Секция III. Характеризация материалов и структур методами РЭМ
Вторник, 1 октября, 18.10

Акберова Эльмара Маликовна, ФГБОУ ВО ВГУ
РЭМ-анализ влияния содержания ионообменника на структурные характеристики мембран Ralex CM Pes

Э.М. Акберова, В.И. Васильева, Д.В. Костылев

Андрухович Ирина Михайловна, ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", Беларусь

Морфологические особенности полученного из электролита с добавкой УДА анодного оксида алюминия

И.В. Гасенкова, И.М. Андрухович

Антонова Наталья Михайловна, Каменский технологический институт (филиал)
Морфология пористых пленок, сформированных из полианионной целлюлозы

Н.М. Антонова, Е.Ю. Хаустова, А.С. Пузанова

Градов Олег Валерьевич, ИНЭПХФ РАН
Исследования электрофизических свойств биомиметических материалов в YMD-режиме: визуализация профилей зарядки и изопотенциальных линий

О.В. Градов, М.А. Градова, П.Л. Александров, А.В. Ратновская

Гременок Валерий Феликсович, ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению"
Crystal structure and morphological properties of Cu₂SnS₃ thin films prepared by sulfurization process

E.P. Zaretskaya, V.F. Gremenok, V.A. Ivanov, A.N. Pyatlitski, N. Akcay, S. Ozclik

Желтякова И.С., ИФТТ РАН
Тонкий фазовый анализ слоистой структуры композитов, полученной растровой электронной микроскопией, с помощью компьютерных технологий

В.П. Коржов, И.С. Желтякова

Кадикова Ирина Фанисовна, ГОСНИИР
Применение метода дифракции отраженных электронов РЭМ при исследовании произведений искусства

И.Ф. Кадикова, М.В. Лукашова, Т.В. Юрьева, А.А. Кудрявцев, В.А. Юрьев

Казьмирук Вячеслав Васильевич, ИПТМ РАН
Определение плоскости фокусировки пучка в РЭМ по зависимости контраста сигнала от потенциала фокусирующего электрода

В.В. Казьмирук, И.Г. Курганов, А.А. Подкопаев, Т.Н. Савицкая

Кийко Вячеслав Михайлович, ИФТТ РАН

Жаропрочные композитные волокна, полученные из исходных оксидов алюминия, кальция и иттрия

В.М. Кийко, Н.И. Новохатская

Кийко. Вячеслав Михайлович, ИФТТ РАН

Слоистые композиты с оксидными композитными пластинами и молибденовой матрицей

Кийко. Вячеслав Михайлович, ИФТТ РАН

Структура и прочность оксидных волокон, содержащих гексаалюминаты бария и лантана

Кийко. Вячеслав Михайлович, ИФТТ РАН

Структура слоисто-волокнистого композита на основе ниобия и волокон сапфира

В.М. Кийко, В.П. Коржов, В.Н. Курлов, К.А. Хвостунков

Кнотько Александр Валерьевич, МГУ

Подтверждение особенностей механизма фазового перехода в замещенных $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ методом РЭМ

А.В. Кнотько, Р. Мардонова

Курганов Илья Геннадьевич, ИПТМ РАН

Оптимизация электронно-оптической системы низковольтного РЭМ

В.В. Казьмирук, И.Г. Курганов, Т.Н. Савицкая

Ларионов Юрий Васильевич, ИОФ РАН

Вариация электронной эмиссии из рельефной структуры под действием электронного пучка низковольтного РЭМ

Ю.В.Ларионов, Ю.В. Озерин

Лобзова Раиса Викторовна, ГОСНИИР

Морфология, состав и структура архитектурной керамики

Р.В. Лозова, О.В. Каримова, Л.О. Магазина

Ломакин Михаил Владимирович, НП "ЛАМ"

Подсчёт микрочастиц, осажденных на подложку, по их изображениям, полученным в РЭМ-РМА, и их микроанализ

В.Г. Дюков, М.В. Ломакин, А.В. Саталина, В.А. Стебельков

Мотылева Светлана Михайловна, ФГБНУ ВСТТИСП

Использование СЭМ в изучении адаптивных реакции растений *Malus domestica* Bork

Муравьева Тамара Ивановна, ИПМех РАН

Изучение морфологии и элементного состава алюминиевых сплавов методами СЭМ

Т.И. Муравьева, И.В. Шкалей

Никулина Аэлита Александровна, НГТУ

Исследование структуры слоев, полученных методом электронно-лучевой наплавки

А.А. Никулина, Т.С. Буренкова, А.Г. Тюрин, А.С. Федорино, С.С. Усачева, А.И. Волокитин

Попов Владимир Алексеевич, НИТУ "МИСиС"

Применение растровой электронной микроскопии высокого разрешения для исследования распределения наноразмерных упрочняющих частиц в композиционных материалах

В.А. Попов, М.Н. Ковальчук

Рогаткина Елена Юрьевна, ИНЭОС РАН

Возможности микрокатодолюминесцентной спектроскопии РЭМ при исследовании художественных материалов

И.Ф. Кадикова, С.А. Малыхин, Е.Ю. Рогаткина, Е.А. Морозова, И.Б. Афанасьев, В.А. Юрьев

Садовская Наталья Владимировна, Филиал АО НИФХИ им. Л. Я. Карпова

Применение методов РЭМ и РСМА для исследования структуры полимер-полимерных композитов на основе поликарбамидов

Н.В. Садовская, Р.С. Хатилов, С.А. Серов, С.А. Хатилов

Степанцов Евгений Аркадьевич, ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН

Подготовка и характеристика поверхности подложек (100)SrLaGaO₄ для выращивания а-ориентированных сверхпроводящих пленок YBa₂Cu₃O₇

Степович Михаил Адольфович, КГУ им. К.Э. Циолковского

О некоторых возможностях использования электронно-лучевых технологий для изучения влияния магнитоимпульсной обработки на структуру и свойства цементного камня

А.Л. Сибирев, М.Н. Шипко, М.А. Степович, А.А. Вирюс, М.В. Акулова, А.Н. Стрельников, Н.Ф. Косенко

Степович Михаил Адольфович, КГУ им. К.Э. Циолковского

Растровая электронная и атомная силовая микроскопия аморфных сплавов системы Al-Fe-Ni-La, подвергнутых магнитоимпульсной обработке

М.Н. Шипко, Н.Д. Бахтеева, А.А. Вирюс, Т.П. Каминская, В.В. Коровушкин, А.Г. Савченко, М.А. Степович, Е.С. Савченко, Е.В. Тодорова

Татаринов Василий Вадимович, ИГХ СО РАН

Сопоставление результатов 2D- и 3D-м оделирования для оценки характеристик возбуждения рентгеновского излучения под воздействием электронного зонда

В.В. Татаринов, А.С. Кузаков, А.С. Макшаков

Татаринов Василий Вадимович, ИГХ СО РАН

Оценка пространственного разрешения рентгеноспектрального микроанализа с электронным зондом при определении элементов по линиям К- и L-серий

В.В. Татаринов, А.С. Кузаков, А.С. Макшаков

Томаев Владимир Владимирович, Санкт-Петербургский технологический институт

Оптические и структурные свойства пленок Zn и ZnO

В.В. Томаев, В.А. Полищук, Т.А. Вартанян, Н.Б. Леонов, Е.А. Васильев, Е.Н. Борисов

Чернов Михаил Сергеевич, Геологический факультет МГУ

Микроморфологические исследования каолинита в гидротермальных глинах термальных полей южной Камчатки

М.С. Чернов, В.Н. Соколов, В.В. Крупская, Р.А. Рузнецов

Юрьева Татьяна Валерьевна, ГОСНИИР

Спектроскопия микрокатодолюминесценции исторического стекла

Т.В. Юрьева, И.Ф. Кадикова, С.А. малыхин, В.А. Юрьев

Янкин Владислав Алексеевич, НИТУ "МИСиС"
Наноструктуризация и исследование поверхности титана
В.А. Янкин, Е.А. Гостева, В.В. Старков

***Секция IV. Сканирующая зондовая микроскопия, зондовая
нанолиитография и спектроскопия***

Среда, 2 октября, 17.30

Антонов Александр Сергеевич, ТвГУ
О фрактальных структурах в пленках никеля и меди
Д.В. Иванов, А.С. Антонов, В.С. Мясниченко, М.С. Афанасьев, Н.Ю. Сдобняков

Валуева Светлана Валерьевна, ИВС РАН
Исследование селен- и серебросодержащих биоактивных наносистем методом АСМ
С.В. Валуева, М.Э. Вылегжанина

Губанова Галина Николаевна, ИВС РАН
**Морфологические особенности композиционных полиимидных пленок для
первапорационных мембран**
Г.Н. Губанова, М.Э. Вылегжанина

Гурьянов Андрей Валерьевич, ЮФУ ИНЭП
**Исследование влияния деформации на резистивные свойства углеродных
нанотрубок методами атомно-силовой микроскопии**
А.В. Гурьянов, М.В. Ильина, О.И. Ильин, О.А. Агеев

Кокатев Александр Николаевич, ФГБОУ ВО ПетрГУ
Влияние отжига на структуру нанотрубчатого оксида титана
А.Н. Кокатев, К.В. Степанова, Н.М. Яковлева, Х. Петтерссен

Криничная Елена Павловна, ИБХФ РАН
**Криохимический синтез и исследование морфологии поверхности полимерных
нанокомпозитов ППК–PbS, ППК–CdS и ППК–S**
Е.П. Криничная, О.П. Иванова, С.А. Завьялов, Т.С. Журавлева

Криничная Елена Павловна, ИБХФ РАН
**Исследование поверхности наноструктурированных пленок дисульфида молибдена,
интеркалированного органическими и неорганическими соединениями**
Е.П. Криничная, О.П. Иванова, А.С. Голубь, Н.Д. Лененко, Т.С. Журавлева

Новак Андрей Викторович, Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Особенности морфологии и структуры тонких пленок кремния
А.В. Новак, В.Р. Новак, Д.И. Смирнова, А.В. Румянцев

Сафарзаде Ашраф Абульфазович, Национальная академия авиации, Азербайджан
**Параметры локального оксидирования зондовыми методами слоистого
полупроводникового кристалла GaSe**
Р.А. Ибрагимов, А.А. Сафарзаде

Сдобняков Николай Юрьевич, ТвГУ
**О механизмах формирования фрактальных структур в металлических пленках на
диэлектрических подложках**
Н.Ю. Сдобняков, Д.И. Иванов, А.С. Антонов, В.С. Мясниченко, М.С. Афанасьев, С.С. Богданов

Черкасов Дмитрий Александрович, ФНИЦ КиФ РАН

Методы зондовой микроскопии в изучении морфологии и магнитных свойств нанопроволок

Д.А. Черкасов, Д.А. Бизяев, Д.В. Панов, И.М. Долуденко, Д.Л. Загорский, А.А. Бухараев, А.В. Анкудинов

Черкун Александр Павлович, Институт спектроскопии РАН (ИСАН)

Магнитная силовая микроскопия тонких плёнок пермаллоя при помощи «двухрезонансного» пьезоэлектрического датчика силы

Щербакова Ольга Олеговна, ИПМех РАН

Использование различных методов микроскопии при исследовании морозостойких резин

О.О. Щербакова, Д.Л. Загорский, В.А. Лапицкая

Щербина Ольга Борисовна, ИХТРЭМС КНЦ РАН

Исследование структуры и механических характеристик Li-ионопроводящей керамики $\text{Li}_{3x}\text{La}_{2/3-x}\text{TiO}_3$ методами сканирующей электронной и зондовой микроскопии

О.Б. Щербина, Г.Б. Куншина, В.В. Ефремов

Секция V. Электронная и ионная литографии

Среда, 2 октября, 17.30

Ильин Олег Игоревич, ЮФУ

Локализация роста углеродных нанотрубок методом фокусированных ионных пучков

О.И. Ильин, Н.Н. Рудык, М.В. Ильина, А.В. Гурьянов, А.А. Федотов

Иржак Артемий Вадимович, ИПТМ РАН

ГІВ-стимулированное переосаждение

А.А. Иржак, В. Ло

Князев Михаил Александрович, ИПТМ РАН

Развитие методов электронно-лучевой литографии для создания периодических рентгеновских дифракционных решеток с эффектом «блеска»

М.А. Князев, А.А. Свинцов

Подкопаев Александр Александрович, ИПТМ РАН

Использование кодов Баркера для повышения точности совмещения и сшивки полей экспонирования в электронно-лучевой литографии

В.В. Казьмирук, А.А. Подкопаев, Т.Н. Савицкая

Румянцев Александр Владимирович, НИУ «МИЭТ»

Оптимизация метода функций уровня для моделирования микро- и наноструктур, формируемых методом фокусированного ионного пучка

А.В. Румянцев, Н.И. Боргардт

Савицкая Татьяна Николаевна, ИПТМ РАН

Расчет миниатюрной формирующей линзы высоковольтного электронного литографа

В.В. Казьмирук, И.Г. Курганов, А.А. Подкопаев, Т.Н. Савицкая

Свинцов Александр Александрович, ИПТМ РАН
Измерение размера пучка в электронной литографии
С.И. Зайцев, М.А. Князев, А.А. Свинцов

Секция VI. Электронно - лучевые технологии: создание микро- и наноструктур, 3D печать, электронно-лучевая сварка, электронно-лучевая плавка

Среда, 2 октября, 17.30

Афанасьева Людмила Евгеньевна, ТвГТУ
Микроструктура и свойства сплава Ti-6Al-4V, полученного по технологии СЭЛП

Зотов Александр Владимирович, ИПТМ РАН
Синтез ZnO и AlN на SiO₂/Si, предварительно экспонированном электронами
А.В. Зотов, Д.М. Седловец, М.А. Князев, М.В. Еставфьева

Коханчик Людмила Сергеевна, ИПТМ РАН
Прямая электронно-лучевая запись доменов в сегнетоэлектрических кристаллах Sr_xBa_{1-x}Nb₂O₆ (x=0,61)
Л.С. Коханчик, Я.В. Боднарчук, Т.Р. Волк, Е.Б. Якимов

Кочугова Елена Сергеевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Формирование однородных по толщине кремниево-германиевых структур методом молекулярно-лучевой эпитаксии
Д.А. Павлов, Е.С. Кочугова, Н.О. Кривулин

Репков Владимир Валерьевич, ИЯФ СО РАН
Управление током электронно-лучевой сварки посредством регулирования мощности лазерного подогрева катода
М.Ю. Косачев, Э.А. Купер, В.В. Репков, Ю.И. Семенов, А.А. Старостенко, А.С. Цыганов

Уткин Дмитрий Евгеньевич, ИФП СО РАН
Создание упорядоченных дисков Ge на поверхности SiO₂
Д.Е. Уткин, А.А. Шкляев

Шандыба Никита Андреевич, ЮФУ ИНЭП
Формирование автоэмиссионных нанокатодов методом фокусированных ионных пучков
Н.А. Шандыба, И.В. Панченко, А.С. Коломийцев, С.А. Лисицын

Секция VII. Новые материалы для микроэлектроники
Понедельник, 30 сентября, 17.00

Аксенов Олег Игоревич, ИФТТ РАН
Исследование влияния напряженного состояния микропроводов при их деформации in situ на магнитную доменную структуру
О.А. Аксенов, Н.Н. Орлова, А.С. Аронин

Алекперов Эльдар Шахсувар, Бакинский государственный университет
Формирование сверхструктуры в эпитаксиальных пленках TlPn_{1-x}Sn_xS₂
М.М. Панахов, Н.Ф.Гахраманов, Э.Ш. Алекперов, А.М. Назаров, С.С. Фарзалиев

Аристова Мария Фёдоровна, ИПТМ РАН

Исследование дефектов структур GaAs/Ge/Si методом наведенного тока в РЭМ

П.С. Вергелес, А.В. Рыков, М.Ф. Аристова, А.В. Здравейцев, В.А. Ковальский, М.В. Дорохин,
В.Г. Шенгуров, С. А. Денисов

Бешенков Владимир Григорьевич, ИПТМ РАН

Метод канонических корреляций в диагностике фазового состава тонких пленок оксида церия на кремнии по оже-спектрам

В.Г. Бешенков, А.Г. Знаменский, В.А. Марченко, В.И. Николайчик

Бешенков Владимир Григорьевич, ИПТМ РАН

Определение состояния поверхности полиэфирэфиркетона после обработки ионными и атомными пучками по РФЭС спектрам C1s методом главных компонент в двойственной постановке

В.Г. Бешенков, С.М. Пестов

Бубликов Евгений Илиодорович, ДГТУ

Никелевые контакты с низким переходным сопротивлением

Е.И. Бубликов, В.И. Кулинич, В.В. Рыбалко

Буташин Андрей Викторович, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

Синтез и микроскопия тонких пленок со структурой шпинели на сапфировых подложках

А.В. Буташин, А.Э. Муслимов, А.Ш. Асваров, Л.А. Задорожная, А.С. Лавриков, В.М. Каневский

Кошевой Вениамин Леонидович, Санкт-Петербургский Горный институт

Функционализация пористого кремния наночастицами различного типа

В.Л. Кошевой, А.О. Белорус, А.С. Леньшин

Маслобоева Софья Михайловна, ИХТРЭМС КНЦ РАН

Использование метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией в технологии получения легированной самарием шихты танталата лития

С.М. Маслобоева, И.Р. Елизарова

Муслимов Арсен Э. , ИК РАН ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН

Гексаалюминат лантана-магния – новый подложечный материал

А.В. Буташин, А.Э. Муслимов, А.Ш. Асваров, В.М. Каневский

Плешанов Илья Михайлович, ИТМО

Исследование люминесценции оксифторидных стекол для применения их в качестве чувствительного элемента датчика искры

И.М. Плешанов, А.О. Белорус, А.А. Васильченко, А.М. Урядышева, Д.С. Агафонова

Чиж Кирилл Всеволодович, ИОФ РАН

Низкотемпературное формирование пленок силицидов платины на поверхности поли-Si

К.В. Чиж, Л.В. Арапкина, Д.В. Ставровский, В.П. Дубков, С.А. Миронов, В.М. Сенков, И.В. Пиршин,
П.И. Гайдук, В.А. Юрьев